

25 MAY 2005

**(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international**



(43) Date de la publication internationale
17 juin 2004 (17.06.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/051314 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷ : **G01T 1/24**,
1/17

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2003/050125

(22) Date de dépôt international :
20 novembre 2003 (20.11.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
02/14737 25 novembre 2002 (25.11.2002) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** [FR/FR];
31-33 rue de la Fédération, F-75752 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et
(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **OU-VRIER-BUFFET, Patrice** [FR/FR]; 100, route du Village, ENTREDOZON, F-74410 Saint-Jorioz (FR). **RUSTIQUE, Jacques** [FR/FR]; 34, rue Pacalaire, F-38170 Seyssinet (FR). **VERGER, Loïck** [FR/FR]; 49, rue du Vercors, F-38000 Grenoble (FR).

(74) Mandataire : **POULIN, Gérard**; c/o BREVATOME, 3 rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

(81) État désigné (national) : US.

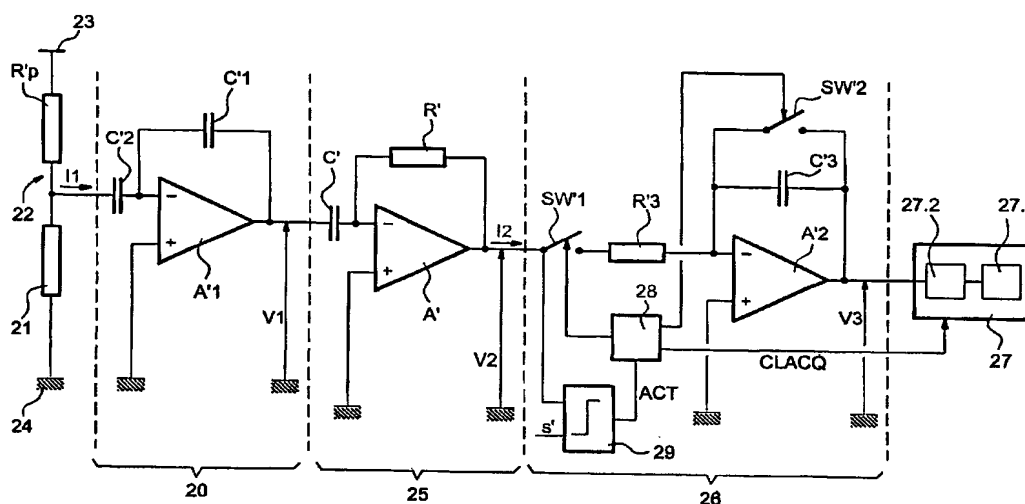
(84) États désignés (régional) : brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Publiée :
— avec rapport de recherche internationale

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: ENHANCED PROCESSING CIRCUIT FOR SPECTROMETRY SYSTEM AND SPECTROMETRY SYSTEM USING SAME

(54) Titre : CIRCUIT DE TRAITEMENT AMELIORE POUR CHAINE DE SPECTROMETRIE ET CHAINE DE SPECTROMETRIE UTILISANT UN TEL CIRCUIT



(57) Abstract: The invention concerns a spectrometry system processing circuit comprising a particulate radiation detector (21), including a charge preamplifying stage (20) receiving a current (I1) from the sensor representing an amount of charges emitted by a particle which has interacted with the detector, and an integrator stage (26). A shunt stage (25) is connected between the charge preamplifying stage (20) and the integrator stage (26), the shunt stage (25) receiving a signal (V1) derived from the charge preamplifying stage (20) and delivering to the integrating stage (26) an image signal (V2) of the sensing current (I1), the integrator stage (26) delivering an image (V3) of the amount of charges emitted by a particle having interacted with the detector. The invention is applicable in particular to high-energy single-channel probes.

[Suite sur la page suivante]

WO 2004/051314 A1



— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrégé :** Il s'agit d'un circuit de traitement pour chaîne de spectrométrie incluant un détecteur de rayonnement particulaire (21), comportant un étage préamplificateur de charges (20) recevant un courant (I1) du détecteur représentatif de la quantité de charges émises par une particule qui a interagi avec le détecteur, et un étage intégrateur (26). Un étage dérivateur (25) est branché entre l'étage préamplificateur de charges (20) et l'étage intégrateur (26), l'étage dérivateur (25) recevant un signal (V1) issu de l'étage préamplificateur de charges (20) et délivrant à l'étage intégrateur (26) un signal (V2) image du courant détecteur (I1), l'étage intégrateur (26) délivrant, une image (V3) de la quantité de charges émises par une particule qui a interagi avec le détecteur. Application notamment aux sondes monovoies à haute énergie.

CIRCUIT DE TRAITEMENT AMELIORE POUR CHAINE DE
SPECTROMETRIE ET CHAINE DE SPECTROMETRIE UTILISANT UN
TEL CIRCUIT

5 DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention est relative à un circuit de traitement pour chaîne de spectrométrie et une chaîne de spectrométrie dotée d'un tel circuit. Une chaîne de spectrométrie est un dispositif apte à
10 mesurer l'énergie d'un rayonnement particulaire incident sur un détecteur de rayonnement. Une telle chaîne de spectrométrie permet également de compter le nombre de particules incidentes par unité de temps. Par rayonnement particulaire, on entend l'émission ou le
15 transfert d'énergie sous forme de particules. Le rayonnement peut être constitué par exemple de photons (les photons étant considérés comme des particules élémentaires stables), être un rayonnement gamma qui est un rayonnement composé de photons émis au cours
20 d'un processus de transition nucléaire ou d'annihilation de particules, être un rayonnement X ou un flux de neutrons ou de protons.

Les chaînes de spectrométrie trouvent leur application notamment dans le domaine médical, dans le
25 contrôle non destructif ou en instrumentation scientifique. Dans le domaine de l'imagerie médicale, les gamma caméras utilisant des détecteurs de rayonnement à deux dimensions se développent rapidement. Avec des détecteurs de rayonnement à une
30 dimension de nombreuses sondes monovoies apparaissent sur le marché ; il s'agit, par exemple, de sondes

préopératoires, de sondes nucléaires pour le contrôle d'assemblages irradiés, de sondes pour l'instrumentation scientifique.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

5 Les chaînes de spectrométrie comportent de manière conventionnelle un détecteur de rayonnement particulaire, un circuit de traitement du signal délivré par le détecteur et un circuit d'acquisition du signal délivré par le détecteur après traitement. Les
10 chaînes de spectrométrie utilisent de préférence des détecteurs de rayonnement à base de semi-conducteurs tels que le CdZnTe, CdTe:Cl, CdTe:In ce qui leur permet de travailler à température ambiante et d'être compactes puisqu'elles n'ont pas besoin de dispositif
15 de refroidissement. Ces détecteurs de rayonnement présentent d'autres avantages. Puisqu'ils convertissent le rayonnement directement en signal électrique (généralement utilisé sous forme d'un courant électrique) au lieu de passer par le stade de charges
20 électriques comme lorsqu'on utilise un scintillateur associé à un photomultiplicateur, ils permettent d'obtenir d'excellentes résolutions en énergie.

Le circuit de traitement doit compter et mesurer avec la plus grande précision possible
25 l'énergie de toutes les particules incidentes ayant interagi avec le détecteur (on parle alors d'efficacité de détection).

Selon les domaines d'utilisation, le rayonnement particulaire incident est constitué d'un
30 spectre en énergie de particules (photons, neutrons ou protons) plus ou moins nombreuses avec une gamme en

énergies très variables (par exemple de quelques keV à quelques MeV pour une spectrométrie gamma). Il faut donc adapter la géométrie du détecteur semi-conducteur, c'est à dire sa surface et son épaisseur, de manière appropriée pour obtenir une efficacité de détection et une sensibilité voulues de la chaîne de spectrométrie. A titre d'exemple, une épaisseur inférieure au millimètre sera suffisante pour arrêter la majorité des photons de basse énergie tandis qu'une épaisseur de quelques millimètres voire un centimètre peut être nécessaire pour arrêter les photons de plus haute énergie. Par basse énergie, on entend des énergies inférieures à environ 100 keV.

La difficulté pour obtenir une spectrométrie de qualité est plus grande à haute énergie qu'à basse énergie car le volume (c'est à dire le produit de sa surface par son épaisseur) du matériau semi-conducteur du détecteur nécessaire à l'absorption de particules de haute énergie doit être plus grand. Une épaisseur importante permet d'arrêter le maximum de particules. La probabilité d'interaction est augmentée. En revanche plus le volume est élevé, plus il est difficile de maintenir un champ homogène tout au long du parcours des charges créées par la conversion dans le détecteur et aussi d'éviter les effets de piégeage des charges dans le matériau semi-conducteur.

Ces effets cumulés au fait que des charges d'ionisation sont créées dans des zones différentes du détecteur impliquent que les détecteurs épais délivrent des impulsions de courant avec de grandes variations de

forme. Cet effet de variation de forme du courant est connu sous le nom de déficit balistique.

On cherche donc à ce que le circuit de traitement soit adapté à cette grande variation de
5 forme du courant et qu'il délivre un signal qui traduise avec la meilleure précision possible la valeur de l'énergie des particules incidentes. En d'autres termes on cherche à compenser le déficit balistique et à améliorer le taux de comptage.

10 Les circuits de traitement conventionnels comportent plusieurs étages successifs parmi lesquels le premier est un préamplificateur de charges qui est destiné à être relié au détecteur, le second un filtre d'impulsions et le troisième un étage de mesure de
15 l'amplitude des impulsions obtenues en sortie du filtre d'impulsions. Un tel circuit de traitement est représenté sur la figure 1.

Le préamplificateur de charges porte la référence 10. C'est un amplificateur A1 réalisé avec
20 des composants discrets (par exemple un transistor à effet de champ) ou des composants intégrés par exemple de type ASIC, monté en intégrateur de courant. Les amplificateurs opérationnels ne sont pas adaptés à cette fonction car trop bruyants. Un condensateur
25 d'intégration C1 est monté entre l'entrée et la sortie de l'amplificateur opérationnel A1. L'amplificateur opérationnel A1 reçoit en entrée un signal électrique il qui provient d'un détecteur 11 de rayonnement particulaire à semi-conducteur. Ce détecteur 11 de
30 rayonnement particulaire est monté en série avec une résistance Rp dans un pont diviseur 12. Le pont

diviseur 12 est branché entre deux bornes 13, 14 d'alimentation d'une alimentation (non représentée). Ce pont diviseur possède un point commun entre la résistance R_p et le détecteur 11 et ce point commun est
5 relié à l'entrée de l'amplificateur opérationnel par l'intermédiaire d'un condensateur C_2 . Le signal i_1 est un courant en impulsions, il est dit courant détecteur. Ces impulsions peuvent prendre une grande variation de formes.

10 Les courbes A et B de la figure 2 sont des chronogrammes du courant détecteur i_1 en entrée du préamplificateur de charges 10 et de la tension v_1 délivrée en sortie du préamplificateur de charges 10.

Pendant le temps de présence des impulsions
15 du courant i_1 , la tension v_1 en sortie du préamplificateur est :

$$v_1 = -1/C_1 \int i_1 dt = -Q/C_1$$

Q est la quantité de charges émises par une particule qui a interagi avec le détecteur 11. En
20 sortie du préamplificateur de charges 10, la tension v_1 décroît en l'absence d'impulsion de courant i_1 . Cet intervalle de temps est appelé temps de relaxation τ_1 . L'information qui correspond à l'énergie des particules est fugitive. Il faut sauvegarder la tension v_1 au plus
25 vite après disparition d'une impulsion de courant i_1 .

La tension v_1 est appliquée à l'entrée d'un filtre d'impulsions 15. Il s'agit d'un filtre passe-bande qui permet d'optimiser le rapport signal sur bruit. De nombreux filtres d'impulsions ont été
30 développés parmi lesquels les filtres à n dérivations et n intégrations, les filtres gaussiens ou semi-

gaussiens, les filtres trapézoïdaux, les filtres
triangulaires, les filtres numériques. Bien souvent ces
filtres sont accordables et il est possible par réglage
des constantes de temps dérivées et intégrales et de
5 façon expérimentale d'ajuster au mieux le rapport
signal sur bruit dans la bande de fréquence utile. Il
est connu que les filtres semi-gaussiens ou
triangulaires conviennent bien pour des forts taux de
comptage car ils permettent une mise en forme plus
10 rapide des impulsions.

Le but est d'obtenir en sortie du filtre
passe-bande 15 des impulsions de tension dont
l'amplitude A_m est proportionnelle à l'énergie des
particules qui ont interagi avec le détecteur 11. La
15 courbe C de la figure 2 montre la tension v_2 présente
en sortie du filtre d'impulsions 15. On remarque que le
filtre d'impulsions 15 altère l'information temporelle
correspondant à la durée du courant i_l fourni par le
détecteur 11. La largeur des impulsions est augmentée à
20 cause de la dérivation et de l'intégration réalisées
par le filtre d'impulsions. Cet effet diminue le taux
de comptage maximum admissible en augmentant le nombre
d'étages dans le circuit de traitement.

Il se peut que la venue d'une impulsion de
25 courant détecteur i_l de rang i (i entier supérieur ou
égal à 2) intervienne avant que la tension v_2 n'ait pu
reprendre la valeur qu'elle avait au début de
l'impulsion de courant détecteur i_l de rang $i-1$. Si
l'amplitude de la tension v_2 lors de l'impulsion de
30 courant détecteur i_l de rang $i-1$ vaut A_m , l'amplitude
de la tension v_2 lors de l'impulsion de courant

détecteur $i1$ de rang i vaut $Am+e1$ et l'amplitude de la tension $v2$ lors de l'impulsion de courant détecteur $i1$ de rang $i+1$ vaut $Am+e2$. L'amplitude de la tension $v2$ est entachée d'autant plus d'erreurs que le taux de comptage est élevé.

Un autre inconvénient du filtre d'impulsions 15 est sa mauvaise linéarité quand il est employé avec des détecteurs épais qui délivrent des impulsions de courant avec de grandes variations de forme possible. Cet inconvénient correspond à l'erreur de déficit balistique. Pour essayer de réduire cette erreur, il est connu de choisir la constante de temps du filtre très supérieure à la durée des impulsions du courant détecteur $i1$. Cette solution est contradictoire avec le souhait d'obtenir une tension $v2$ avec des impulsions de courte durée, ce qui permet un fort taux de comptage.

La sortie du filtre d'impulsions est reliée à des moyens 16 de mesure de l'amplitude des impulsions obtenues en sortie du filtre d'impulsions 15. Plusieurs montages peuvent être employés pour réaliser ces moyens de mesure d'amplitude 16. On peut citer par exemple un détecteur de crêtes à base de diodes ou un intégrateur actif susceptible d'être commandé par commutation. Il est communément admis que l'intégrateur susceptible d'être commandé par commutation permet d'obtenir des taux de comptage plus élevés.

Les moyens de mesure d'amplitude 16 de la figure 1 comportent un amplificateur opérationnel $A2$ monté en intégrateur. Un condensateur d'intégration $C3$ est monté entre l'entrée et la sortie de

l'amplificateur opérationnel A2. Une résistance R3 a une extrémité reliée à l'entrée de l'amplificateur opérationnel et une autre extrémité reliée à la sortie du filtre d'impulsions 15 par l'intermédiaire d'un premier commutateur SW1. Un second commutateur SW2 est monté en parallèle avec le condensateur d'intégration C3. Il sert à la remise à zéro de l'intégrateur.

On se réfère maintenant à la figure 3 qui représente sous forme de chronogrammes et de manière schématique respectivement le signal en impulsion v2 délivré par le filtre d'impulsions (courbe A) et le signal v3 délivré par les moyens de mesure de l'amplitude des impulsions obtenues en sortie du filtre d'impulsions (courbe B). Avant que le signal v2 issu du filtre d'impulsions 15 n'arrive en entrée des moyens de mesure d'amplitude 16, c'est à dire antérieurement à un instant t_0 , le premier commutateur SW1 est ouvert et le second commutateur SW2 est fermé. Dès que le signal v2 franchit un seuil s, à l'instant t_0 , le premier commutateur SW1 se ferme et le second commutateur SW2 s'ouvre. Les moyens de mesure d'amplitude 16 commencent à intégrer le signal v2 jusqu'à un instant t_1 qui marque le passage du signal v2 au-dessous du seuil s. A cet instant t_1 , le premier commutateur SW1 s'ouvre. Le signal v3 délivré par les moyens de mesure d'amplitude 16 a une amplitude kA_m qui est proportionnelle à l'amplitude A_m du signal v2. Mais cette amplitude kA_m n'est proportionnelle à l'énergie de la particule ayant interagi avec le détecteur 11 que dans la mesure où l'amplitude A_m traduisait fidèlement l'énergie de la particule ayant interagi avec le détecteur 11. On a vu

précédemment que cela n'était pas toujours le cas à cause des défauts apportés par le filtre d'impulsions 15.

De l'instant t_1 à un instant t_2 , le signal
5 v3 est maintenu sensiblement constant de manière à pouvoir sauvegarder son amplitude dans un dispositif d'acquisition 17 relié à la sortie des moyens de mesure de l'amplitude 16. A partir de l'instant t_2 , le second commutateur SW2 est fermé ce a qui pour effet de
10 ramener le signal v3 à zéro. Les moyens de mesure de l'amplitude 16 sont alors prêts à traiter une nouvelle particule.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

La présente invention a pour but de
15 réaliser un circuit de traitement pour une chaîne de spectrométrie ne présentant pas les limitations et difficultés ci-dessus, ces difficultés étant apportées notamment par le filtre d'impulsions.

Elle a pour but de proposer un circuit de
20 traitement pour une chaîne de spectrométrie qui soit susceptible de délivrer un signal traduisant avec précision l'énergie des particules incidentes et ce même avec des taux de comptage élevés.

Pour y parvenir l'invention préconise de
25 remplacer le filtre d'impulsions par un dérivateur délivrant un signal qui est une image fidèle de celui qui provient du détecteur de rayonnement et qui est représentatif de l'énergie de particules qui interagissent avec le détecteur.

30 Plus précisément la présente invention est un circuit de traitement pour chaîne de spectrométrie

incluant un détecteur de rayonnement particulaire, ce circuit de traitement comportant un étage préamplificateur de charges recevant un courant du détecteur représentatif de la quantité de charges
5 émises par une particule qui a interagi avec le détecteur, et un étage intégrateur. Un étage dérivateur est branché entre l'étage préamplificateur de charges et l'étage intégrateur, l'étage dérivateur recevant un signal issu de l'étage préamplificateur de charges et
10 délivrant à l'étage intégrateur un signal image du courant détecteur, l'étage intégrateur délivrant une image de la quantité de charges émises par une particule qui a interagi avec le détecteur.

L'étage préamplificateur de charges peut
15 comporter un amplificateur discret ou intégré monté en intégrateur de courant.

L'étage dérivateur peut comporter un amplificateur opérationnel monté en dérivateur (connu sous la dénomination "differentiator" en langue
20 anglaise).

L'étage intégrateur peut comporter un amplificateur opérationnel monté en intégrateur.

Le courant détecteur est en impulsions et de préférence, l'étage intégrateur comporte des moyens
25 de commande de la durée de l'intégration pendant des durées sensiblement égales à la durée de chaque impulsion du courant détecteur. De cette manière, le circuit intégrateur est auto-adapté au courant détecteur.

30 Les moyens de commande de la durée de l'intégration peuvent comporter un premier commutateur

inséré entre l'intégrateur et la sortie de l'étage dérivateur, un second commutateur de remise à zéro de l'intégrateur, un circuit logique de commande des commutateurs, un comparateur pour activer le circuit
5 logique en fonction du résultat d'une comparaison entre le signal image du courant détecteur et un seuil.

La présente invention concerne également une chaîne de spectrométrie qui comporte un circuit de traitement ainsi caractérisé en aval du détecteur de
10 rayonnement particulaire.

Une telle chaîne de spectrométrie conserve une bonne linéarité sur une grande gamme d'énergie à mesurer.

Un autre but de l'invention est de proposer
15 une chaîne de spectrométrie dont le déficit balistique est compensé et dont le taux de comptage est amélioré.

Encore un autre but de l'invention est de proposer une chaîne de spectrométrie qui peut fonctionner sans aucune modification avec plusieurs
20 modèles de détecteurs.

La chaîne de spectrométrie peut comporter de plus, un circuit d'acquisition du signal délivré par l'étage intégrateur du circuit de traitement, ce circuit d'acquisition comportant un convertisseur
25 analogique numérique suivi d'une mémoire.

Un signal délivré par le circuit logique peut conditionner la durée de l'acquisition.

Le détecteur peut être inséré avec une résistance dans un montage de pont diviseur.

30 Le détecteur est avantageusement un détecteur à semi-conducteur.

Le matériau semi-conducteur peut être choisi dans le groupe comprenant CdZnTe, CdTe:Cl, CdTe:In.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

5 La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés, à titre purement indicatif et nullement limitatif, en faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

10 la figure 1 (déjà décrite) montre un schéma électrique d'une chaîne de spectrométrie de l'art antérieur ;

la figure 2 (déjà décrite) montre des chronogrammes illustrant, avec la référence A, le courant i_1 délivré par le détecteur de rayonnement
15 particulaire, avec la référence B, la tension v_1 délivrée par le préamplificateur de charges et avec la référence C, la tension v_2 délivrée par le filtre d'impulsions de la chaîne de spectrométrie de la figure
20 1 ;

la figure 3 (déjà décrite) montre des chronogrammes illustrant, avec la référence A, une impulsion de la tension v_2 et avec la référence B, la tension v_3 délivrée par une chaîne de spectrométrie
25 comparable à celle de la figure 1 ;

la figure 4 est un schéma électrique d'un circuit de traitement conforme à l'invention et d'une chaîne de traitement incluant un tel circuit de traitement ;

30 la figure 5 montre des chronogrammes illustrant avec la référence A, le courant détecteur i_1

reçu par le circuit de traitement de la figure 4, avec la référence B, la tension V1 présente en sortie de l'étage préamplificateur de charges, avec la référence C, la tension V2 présente en sortie de l'étage dérivateur, avec la référence D, la tension V3 présente en sortie de l'étage intégrateur, avec la référence E, le signal ACT délivré par le comparateur et avec la référence F, le signal CLACQ délivré au circuit d'acquisition ;

la figure 6 montre respectivement, avec les références A et B, des variations de la tension obtenue en sortie du préamplificateur de charges et du circuit dérivateur d'un circuit de traitement selon l'invention en phase de test ;

la figure 7 montre l'allure du diagramme de Bode du filtre passe-haut constitué par l'étage dérivateur du circuit de traitement selon l'invention ;

la figure 8 montre l'allure du diagramme de Bode du filtre passe-bande que constitue l'ensemble formé par l'étage dérivateur et l'étage intégrateur du circuit de traitement selon l'invention ;

la figure 9 illustre la linéarité d'une chaîne de spectrométrie selon l'invention.

Des parties identiques, similaires ou équivalentes des différentes figures décrites ci-après portent les mêmes références numériques de façon à faciliter le passage d'une figure à l'autre.

Les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

On se réfère maintenant à la figure 4 qui montre un schéma électrique d'un circuit de traitement selon l'invention dont est dotée une chaîne de spectrométrie selon l'invention. Comme dans l'art antérieur, le circuit de traitement est destiné à coopérer avec un détecteur 21, il comporte trois étages successifs référencés respectivement 20, 25, 26. On suppose que le détecteur 21 est comparable à celui de la figure 1 et qu'il est inclus dans un montage de pont diviseur 22, incluant une résistance R'p, sur lequel on ne revient pas dans un but de simplification. Les bornes d'alimentation portent respectivement les références 23, 24.

L'étage 20 est également comparable à celui de la figure 1. Il s'agit d'un préamplificateur de charges. Il comporte un amplificateur discret ou intégré par exemple de type ASIC A'1 monté en intégrateur de courant. Un condensateur d'intégration C'1 est monté entre l'entrée et la sortie du préamplificateur A'1. Ce dernier a une entrée qui est reliée au point commun du diviseur de tension 22 par l'intermédiaire d'un condensateur C'2. Le préamplificateur de charges reçoit donc un courant I1 (dit courant détecteur) délivré par le détecteur 21 lorsque des particules interagissent avec lui. Il délivre un signal V1 tel que :

$$V1(t) = -\frac{1}{C'1} \int I1(t) dt = -Q'/C'1 \quad (1)$$

Q' est la quantité de charges émises par une particule qui a interagi avec le détecteur 21.

La différence essentielle par rapport à la chaîne de spectrométrie de l'art antérieur est que l'étage suivant 25 n'est plus formé d'un filtre d'impulsions mais d'un dérivateur. De manière conventionnelle, ce dérivateur comporte un amplificateur opérationnel A' avec une résistance R' branchée entre son entrée et sa sortie. L'entrée de l'amplificateur opérationnel est branchée à la sortie de l'étage préamplificateur de charges 20 par l'intermédiaire d'un condensateur C' . Le dérivateur 25 réalise la fonction mathématique dérivée par rapport au temps sur le signal $V_1(t)$ présent en sortie de l'étage préamplificateur de charges 20. L'étage dérivateur 25 délivre une tension $V_2(t)$ tel que :

$$V_2(t) = R'C' dV_1(t)/dt \quad (2)$$

En combinant les expressions (1) et (2), il vient que la tension en sortie de l'étage dérivateur s'exprime par:

$$V_2(t) = \frac{R'C'}{C_1} I_1(t) \quad (3)$$

Le signal $V_2(t)$ est un signal proportionnel au courant détecteur $I_1(t)$, il est dit signal image du courant détecteur $I_1(t)$.

La figure 5 illustre avec les références A, B, C des chronogrammes des signaux I_1 , V_1 , V_2 qui sont respectivement le courant détecteur, la tension en sortie de l'étage préamplificateur et la tension en sortie de l'étage dérivateur. Le signal $V_2(t)$ est un signal en impulsions dont la durée comprise entre les instants t'_0 et t'_1 correspond sensiblement à la durée

des impulsions du courant détecteur. Le signal $V_2(t)$ correspond à la dérivée mathématique du signal $V_1(t)$. Il prend donc un signe positif pour les pentes croissantes de $V_1(t)$ et un signe négatif pour les pentes décroissantes.

Le rapport d'amplification qui est le rapport $\frac{R'C'}{C_1}$ est choisi le plus grand possible. Dans l'exemple qui sera développé par la suite le rapport d'amplification est choisi égal à $10^7 \Omega$

On configure la partie active du dérivateur (c'est à dire son amplificateur opérationnel A') pour qu'il soit suffisamment rapide et délivre un signal V_2 avec des fronts raides de manière à ce qu'il traduise le plus fidèlement possible l'information temporelle du courant détecteur I_1 .

L'étage dérivateur 25 est un étage qui n'est pratiquement pas générateur de bruit. Ramené à son entrée, le bruit propre de l'étage dérivateur 25 est bien inférieur au bruit apporté par le premier étage 20 du préamplificateur de charges. Typiquement, il peut être inférieur à un pour cent du bruit apporté par le préamplificateur de charges. A titre d'exemple, la figure 6 illustre, à partir de mesures obtenues à l'aide d'une chaîne de spectrométrie selon l'invention, l'allure des signaux V_1 (courbe A) et V_2 (courbe B): les impulsions pratiquement invisibles sur la courbe A le sont très bien sur la courbe B. V_2 est une image du courant I_1 .

L'étage dérivateur 25 se comporte comme un filtre passe-haut. La figure 7 montre le diagramme de

Bode d'un tel étage en choisissant une constante de temps $R'C'$ égale à une microseconde.

Le bruit basse fréquence (bruit en $1/F$) est atténué mais pas le bruit haute fréquence, car le
5 dérivateur ne constitue que la partie passe-haut d'un filtre passe-bande.

Le troisième étage 26 est un étage intégrateur susceptible d'être commandé par commutation et qui réalise la fonction mathématique intégrale. A la
10 différence du circuit de traitement de l'art antérieur, dans le circuit de traitement selon l'invention c'est bien une intégration que l'on veut réaliser pas seulement une détection de l'amplitude des impulsions obtenues en sortie du filtre d'impulsions : on obtient
15 une tension V_3 image de la quantité de charges fournies par le détecteur.

L'étage intégrateur 26 comporte un intégrateur à amplificateur opérationnel $A'2$ avec un condensateur d'intégration $C'3$ monté entre son entrée
20 et sa sortie. Son entrée est reliée à la sortie de l'étage dérivateur 25 par l'intermédiaire d'une résistance $R'3$. L'intégrateur est susceptible d'être commandé par commutation. On prévoit un premier commutateur $SW'1$ monté entre la sortie de l'étage
25 dérivateur 25 et la résistance $R'3$ et un second commutateur $SW'2$ monté en parallèle avec le condensateur d'intégration $C'3$. Le premier commutateur $SW'1$ va commander la fonction intégration et le second commutateur $SW'2$ va commander la remise à zéro de
30 l'intégrateur. Après avoir traité des informations relatives à l'interaction d'une particule,

l'intégrateur est remis à zéro avant qu'il ne traite des informations relatives à une autre particule.

Les commutateurs SW'1, SW'2 sont commandés par un circuit logique 28 qui est activé par un signal ACT apparaissant en sortie d'un comparateur 29, ce comparateur étant destiné à comparer le signal V2 présent en sortie de l'étage dérivateur 25 à un seuil s', ce seuil devant être plus élevé que la tension de bruit de V2.

On rappelle que le signal V2 est un signal image du courant détecteur I1. Sur la figure 5, la référence A illustre l'allure courant détecteur I1, la référence B illustre l'allure du signal V1 en sortie de l'étage préamplificateur, la référence C illustre l'allure du signal V2 en sortie de l'étage dérivateur, la référence D illustre l'allure du signal V3 en sortie de l'étage intégrateur.

Avant l'instant t'0, le signal V2 est inférieur au seuil s', le premier commutateur SW'1 est ouvert et le second commutateur SW'2 est fermé. Le signal V3 en sortie de l'intégrateur est à un niveau bas. Le comparateur 29 délivre le signal d'activation ACT de l'intégrateur. Avant l'instant t'0 le signal ACT a un niveau bas. Ce signal est illustré avec la référence E de la figure 5.

A l'instant t'0, le signal V2 dépasse le seuil s', le signal ACT en sortie du comparateur 29 passe à un niveau haut, active le circuit logique 28 qui commande la fermeture du premier commutateur SW'1 et l'ouverture du second commutateur SW'2.

L'intégrateur commence à intégrer et délivre un signal V3 tel que :

$$V3(t) = -\frac{1}{R'3C'3} \int V2(t) dt \quad (4)$$

En combinant les expressions (3) et (4) il

5 vient :

$$V3(t) = \frac{R'C'}{R'3C'3C'1} \int I1(t) dt \quad (5)$$

En combinant les expressions (5) et (1) il vient :

$$V3(t) = -\frac{R'C'}{R'3C'3C'1} Q' \quad (6)$$

10 Le signal V3(t) délivré par l'étage dérivateur est proportionnel à la quantité de charges qui a interagi, pour une particule, avec le détecteur et donc à l'énergie de la particule.

A l'instant t'1 le signal V2 repasse en
 15 dessous du seuil s', le premier commutateur SW'1 est ouvert et le second commutateur SW'2 conserve son état ouvert. Le signal $V3(t) = -\frac{R'C'}{R'3C'3C'1} \int I1(t) dt$ est
 sauvegardé dans une mémoire 27.1 d'un étage d'acquisition 27 de la chaîne de spectrométrie objet de
 20 l'invention, cet étage d'acquisition étant branché en sortie de l'étage d'intégration 26. Le signal V3 est au préalable numérisé par un convertisseur analogique numérique 27.2 qui se trouve dans l'étage d'acquisition 27. La durée pendant laquelle s'effectue l'acquisition
 25 est commandée par un signal en impulsions CLACQ délivré par le circuit logique 28 à l'instant t'1 et dont la durée (t'2-t'1) est suffisante pour que l'acquisition puisse se faire correctement. Le signal CLACQ est

illustré avec la référence F sur la figure 5. Ce signal présente un front montant à l'instant $t'1$.

Lorsque cette durée est écoulée, c'est à dire à l'instant $t'2$, le signal CLACQ présente un front descendant. L'intégrateur est remis à zéro et le signal V3 repasse au niveau bas. L'intégrateur est prêt à traiter un signal provenant d'une autre particule. L'intégrateur ne fonctionne que pendant une durée sensiblement égale à la durée T_m des impulsions du courant détecteur I1. En d'autres termes l'intégration n'a lieu que pendant la durée de vie des impulsions du courant détecteur I1.

L'ensemble formé de l'étage dérivateur et de l'étage intégrateur forme un filtre passe-bande. Mais ce qui est très intéressant est que les constantes de temps du filtre passe-bande sont auto-adaptatives en fonction de la forme du courant détecteur I1. Cet avantage est obtenu grâce au fait que l'intégration n'a lieu que sensiblement pendant la durée T_m des impulsions du courant détecteur I1.

La figure 8 illustre le diagramme de Bode de deux filtres passe-bande de circuits de traitement selon l'invention. La fréquence centrale du filtre s'exprime par

$f_c = 0,44/T_m$, son gain par

$G_{dc} = T_m/R'3C'3$ et le temps de traitement d'une particule, en l'occurrence un photon, est de $1,5 \mu s$ y compris la remise à zéro.

La courbe A est obtenue avec $T_m = 0,1 \mu s$ et la courbe B pour $T_m = 1 \mu s$. Pour chaque particule, quel que soit son lieu d'interaction avec le détecteur, la

durée T_m du courant détecteur I_1 ou le temps de montée en sortie du préamplificateur vient caler la fréquence centrale f_c du filtre passe-bande, ce qui permet de garder un rapport signal sur bruit optimal. Un tel circuit de traitement est auto-adaptatif au détecteur avec lequel il coopère dans la chaîne de spectrométrie. Il s'adapte au détecteur quelle que soit son épaisseur sans aucun réglage d'un quelconque paramètre extérieur.

Les courbes des figures 7 et 8 ont été obtenues avec un prototype chaîne de spectrométrie selon l'invention prenant la forme d'une sonde monovoie destinée à déterminer le taux de combustion d'assemblages irradiés en mesurant simultanément du Césium 137 et de l'Europium 154. Une telle sonde peut effectuer des mesures spectrométriques entre 100 keV et 2 MeV. Le détecteur est un détecteur CdZnTe en barrette d'épaisseur de 1 centimètre. Une source de rayonnement particulaire en Césium 137 a été utilisée. La courbe de la figure 9 illustre la variation du nombre de coups (c'est à dire de particules) par seconde NCD détectés par la sonde dans tout le spectre en fonction du nombre de particules par seconde NCR émises par la source et arrivant sur le détecteur. La chaîne de spectrométrie possède une bonne linéarité jusqu'à environ $1,5 \cdot 10^6$ coups/s. Au-delà, le nombre de coups/s détectés décroît alors que le nombre de coups/s arrivant sur le détecteur continue d'augmenter.

Par rapport aux performances des chaînes spectrométriques conventionnelles à fort taux de comptage par exemple de type EG&G973U (cette référence est celle d'une chaîne bien connue par les spécialistes

: elle apparaît au catalogue du fabricant ORTEC) avec un détecteur au germanium, le taux de comptage obtenu est cinq fois supérieur et ceci avec un détecteur épais dans lequel le temps de transit des particules est
5 d'environ 1 μ s ce qui est bien plus défavorable que le détecteur au germanium.

Bien qu'un certain mode de réalisation de la présente invention ait été représenté et décrit de façon détaillée, on comprendra que différents
10 changements et modifications puissent être apportés sans sortir du cadre de l'invention.

REVENDICATIONS

1. Circuit de traitement pour chaîne de spectrométrie incluant un détecteur de rayonnement particulaire (21), comportant un étage préamplificateur de charges (20) recevant un courant (I1) en impulsions du détecteur représentatif de la quantité de charges émises par une particule qui a interagi avec le détecteur, un étage intégrateur (26) avec un intégrateur d'un étage dérivateur (25) branché entre l'étage préamplificateur de charges (20) et l'étage intégrateur (26), l'étage dérivateur (25) recevant un signal (V1) issu de l'étage préamplificateur de charges (20) et délivrant à l'étage intégrateur (26) un signal (V2) image du courant détecteur (I1), l'étage intégrateur (26) délivrant une image (V3) de la quantité de charges émises par une particule qui a interagi avec le détecteur, caractérisé en ce que l'étage intégrateur (26) comporte des moyens de commande (28, 29, SW'1, SW'2) de la durée de l'intégration sensiblement pendant la durée de chaque impulsion du courant détecteur.

2. Circuit de traitement selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étage préamplificateur de charges (20) comporte un amplificateur discret ou intégré (A'1) monté en intégrateur de courant.

3. Circuit de traitement selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'étage

dérivateur (25) comporte un amplificateur opérationnel (A') monté en dérivateur.

4. Circuit de traitement selon l'une des
5 revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'étage intégrateur (26) comporte un amplificateur opérationnel (A'2) monté en intégrateur.

5. Circuit de traitement selon l'une des
10 revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de commande de la durée de l'intégration comportent un premier commutateur (SW'1) inséré entre l'intégrateur et la sortie de l'étage dérivateur (25), un second commutateur (SW'2) de remise à zéro de l'intégrateur,
15 un circuit logique (28) de commande des commutateurs, un comparateur (29) pour activer le circuit logique (28) en fonction du résultat d'une comparaison entre le signal image du courant détecteur (V2) et un seuil (s').

20

6. Chaîne de spectrométrie comportant un détecteur de rayonnement particulaire (21), caractérisée en ce qu'elle comporte en aval du détecteur (21), un circuit de traitement selon l'une
25 des revendications 1 à 5.

7. Chaîne de spectrométrie selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'elle comporte un circuit d'acquisition (27) du signal (V3) délivré par
30 l'étage intégrateur (26) du circuit de traitement, ce

circuit d'acquisition (27) comportant un convertisseur analogique numérique (27.2) suivi d'une mémoire (27.1).

8. Chaîne de spectrométrie selon la
5 revendication 7, caractérisée en ce qu'un signal (ACT) délivré par le circuit logique (28) conditionne la durée de l'acquisition.

9. Chaîne de spectrométrie selon l'une des
10 revendications 6 à 8, caractérisée en ce que le détecteur (21) est inséré avec une résistance (R'p) dans un montage de pont diviseur.

10. Chaîne de spectrométrie selon l'une des
15 revendications 6 à 9, caractérisée en ce que le détecteur (21) est un détecteur à semi-conducteur.

11. Chaîne de spectrométrie selon la
revendication 10, caractérisée en ce que le matériau
20 semi-conducteur est choisi dans le groupe comprenant CdZnTe, CdTe:Cl, CdTe:In.

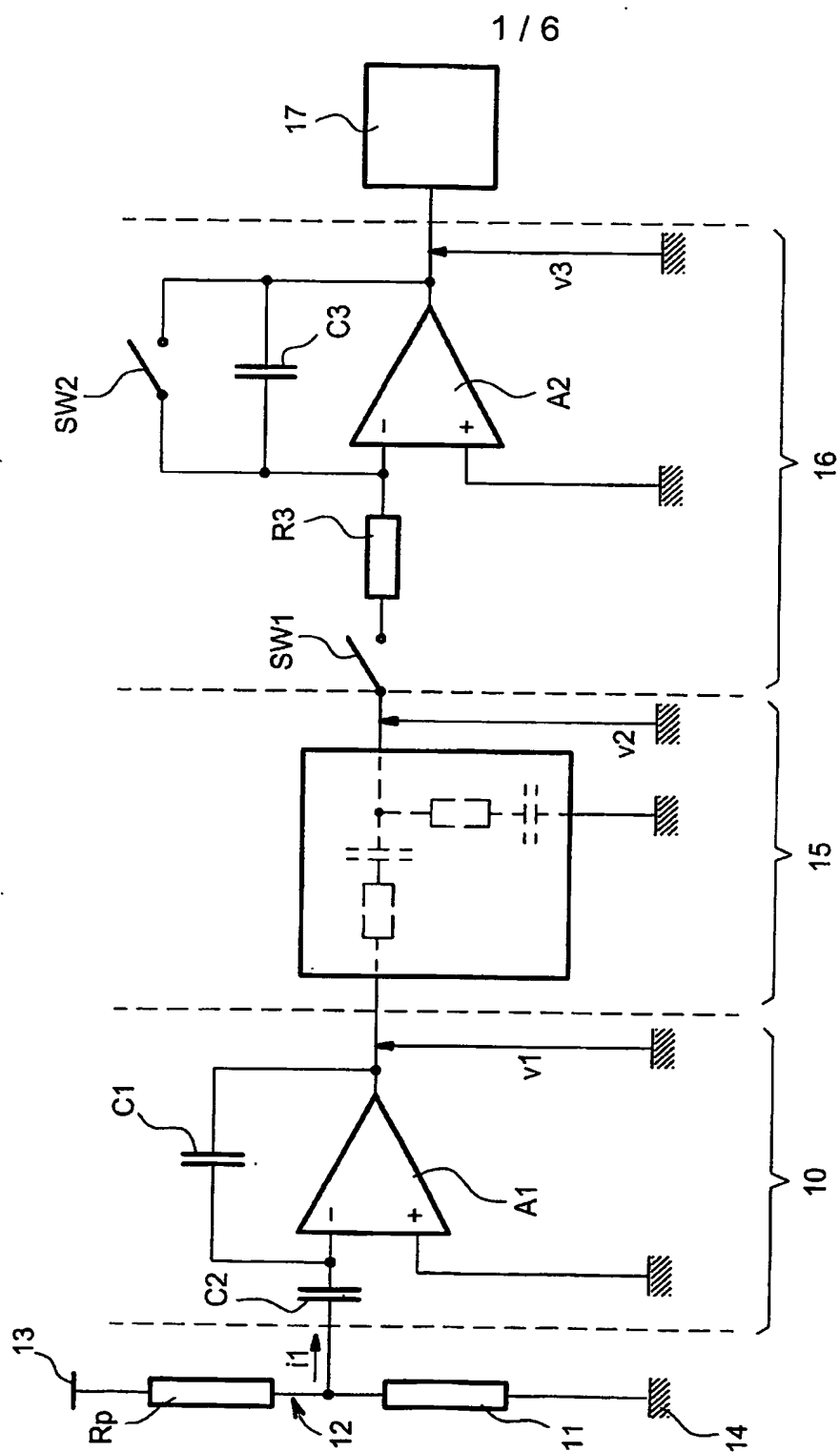


FIG. 1

2 / 6

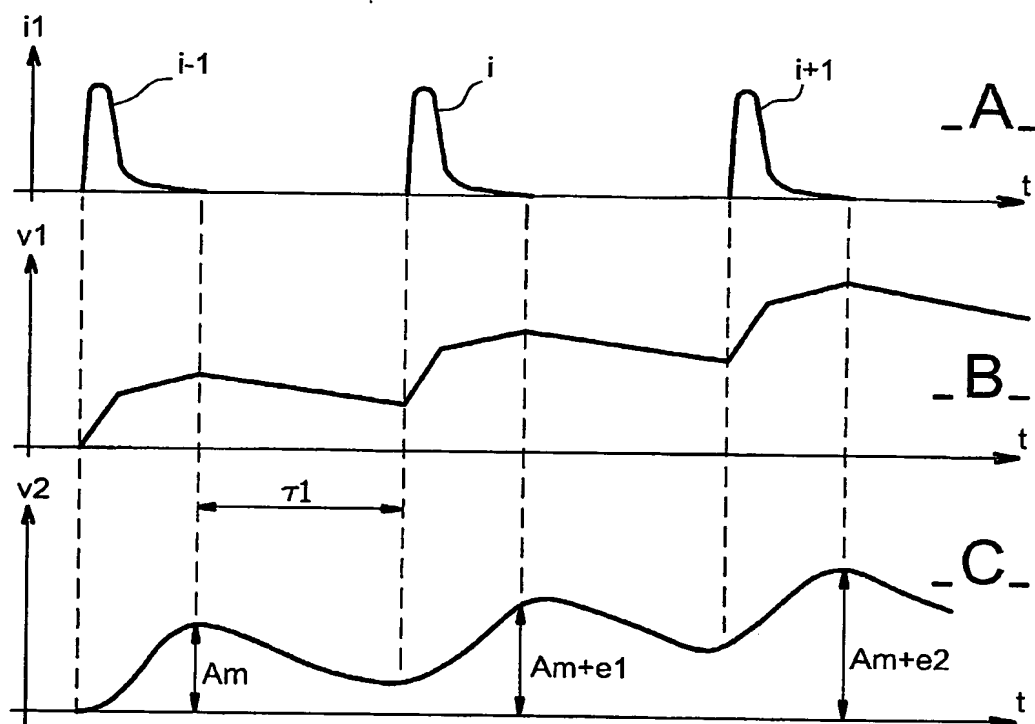


FIG. 2

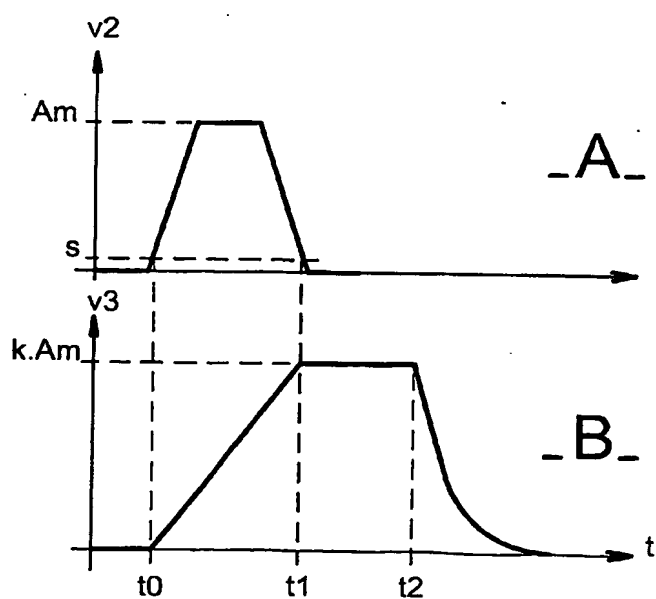


FIG. 3

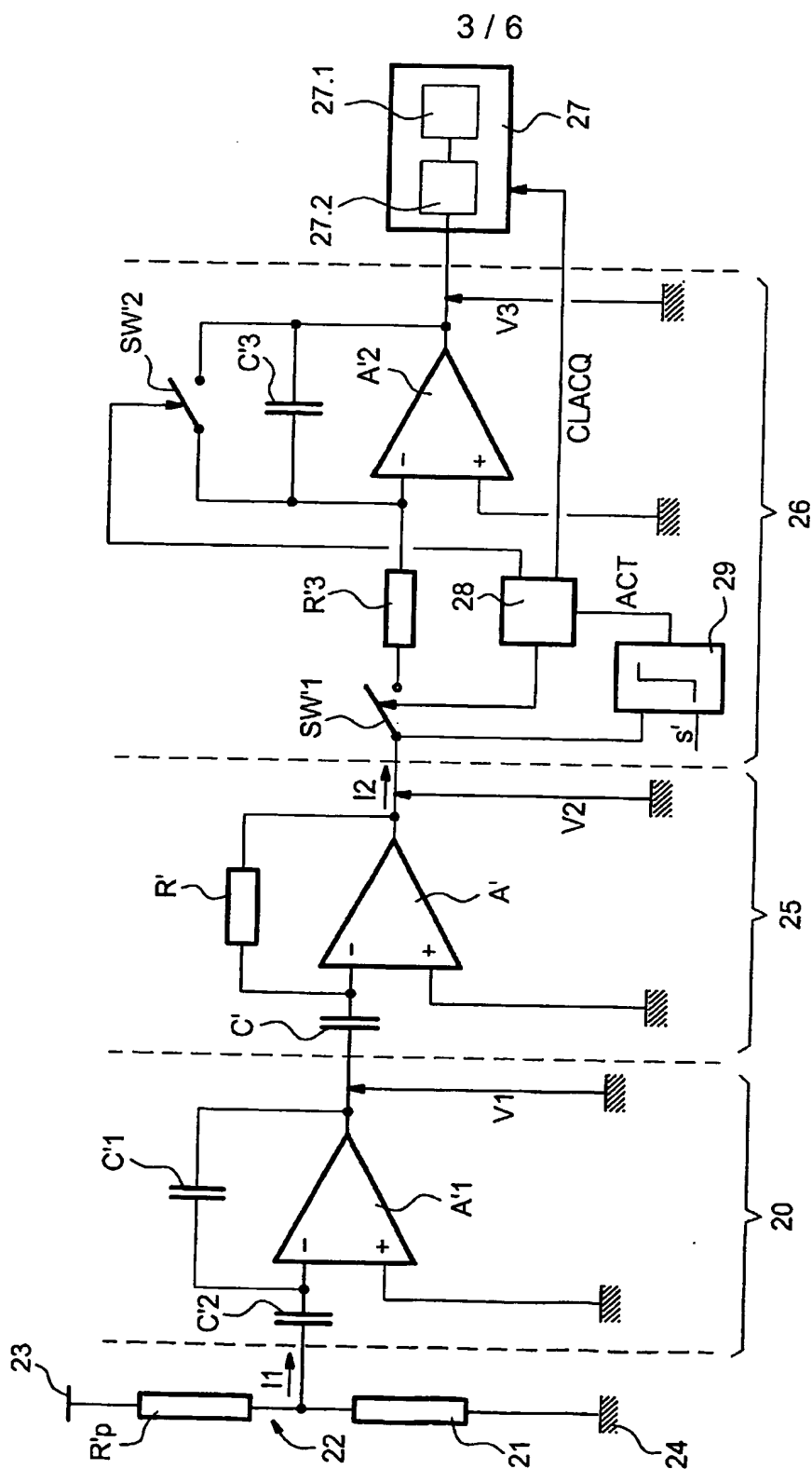


FIG. 4

4 / 6

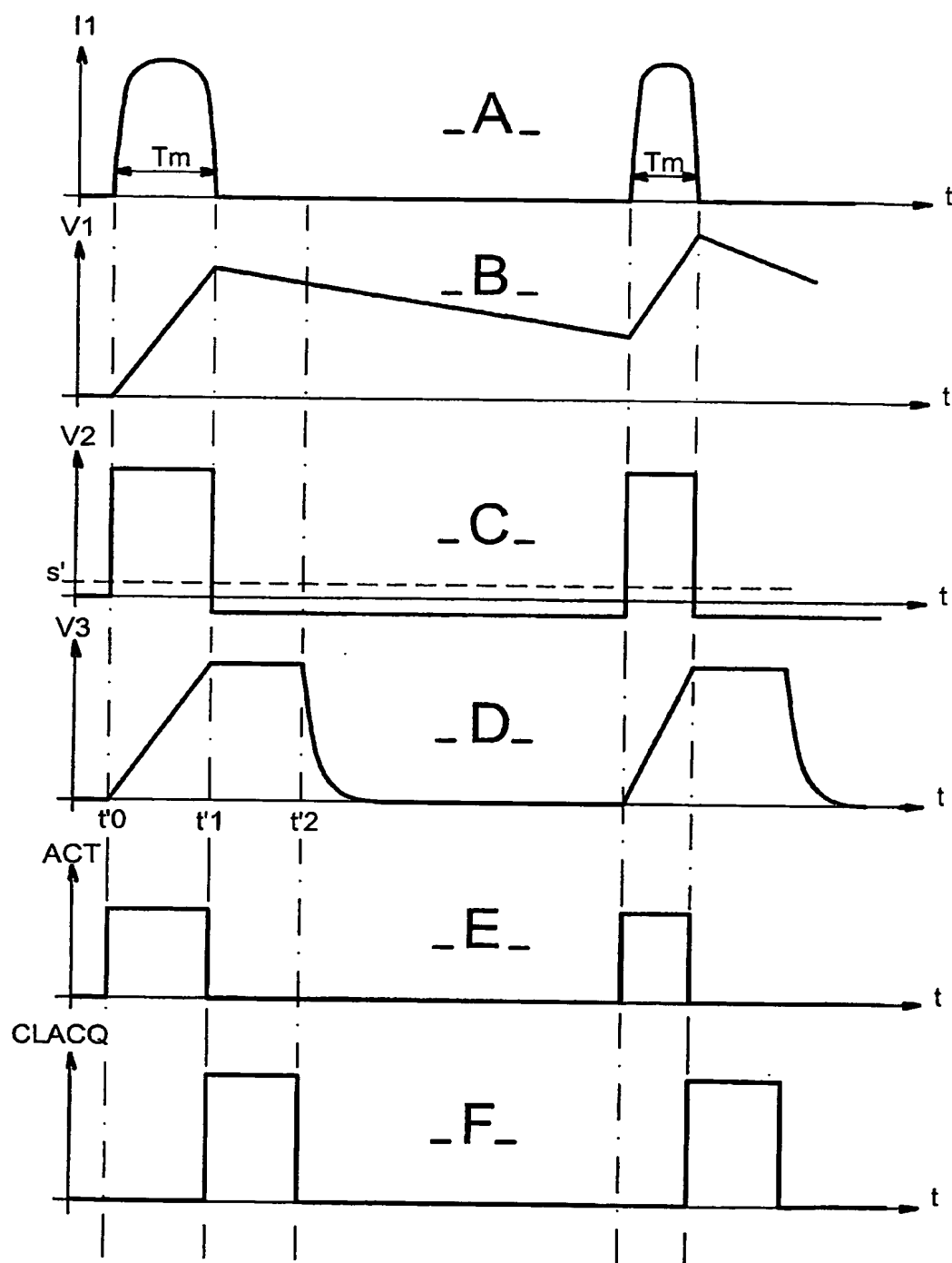


FIG. 5

5 / 6

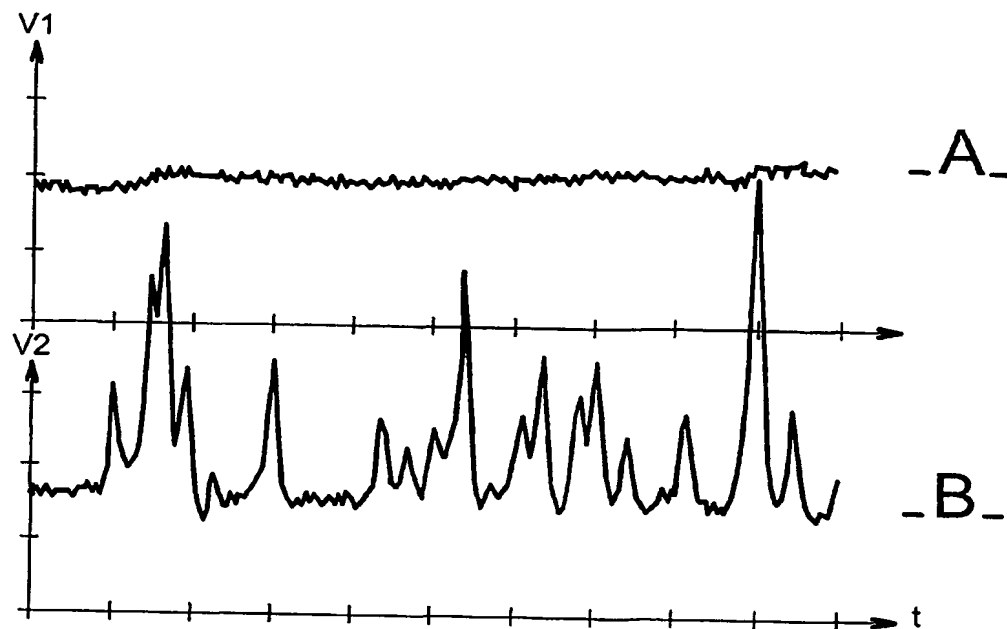


FIG. 6

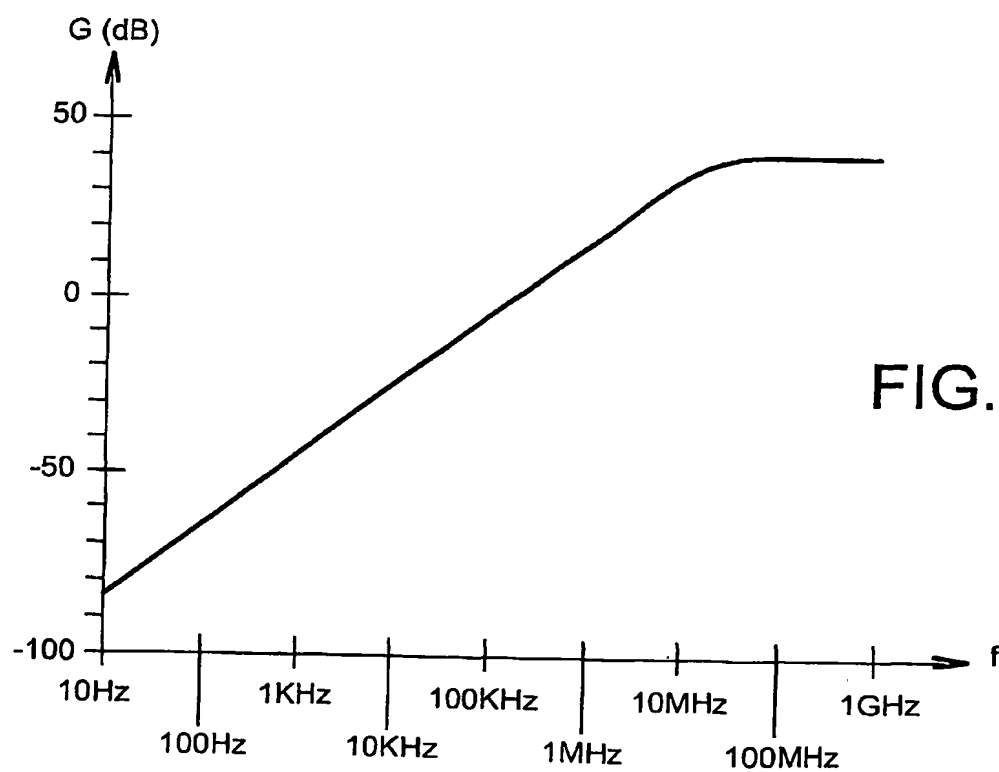


FIG. 7

6 / 6

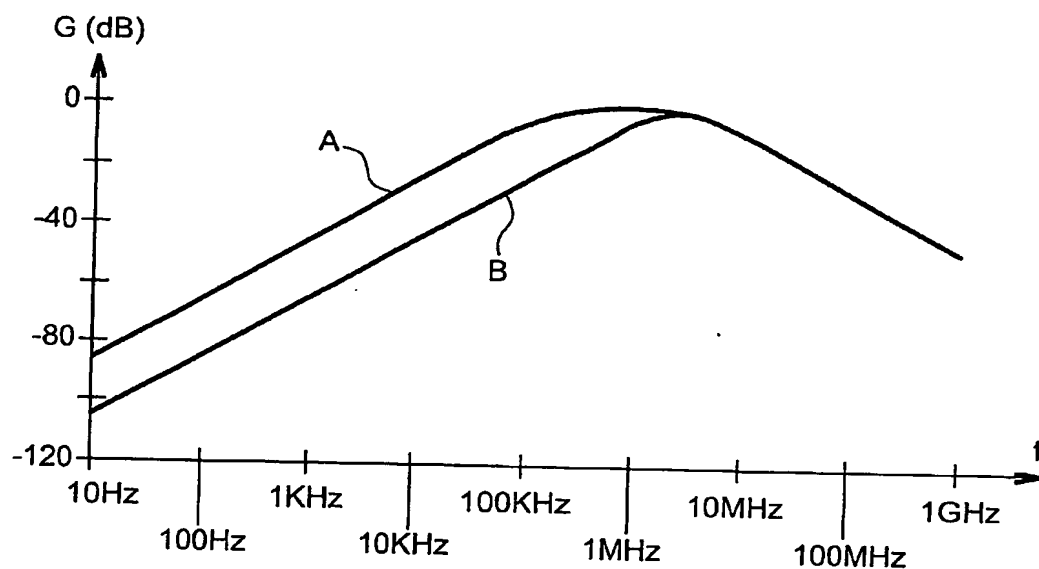


FIG. 8

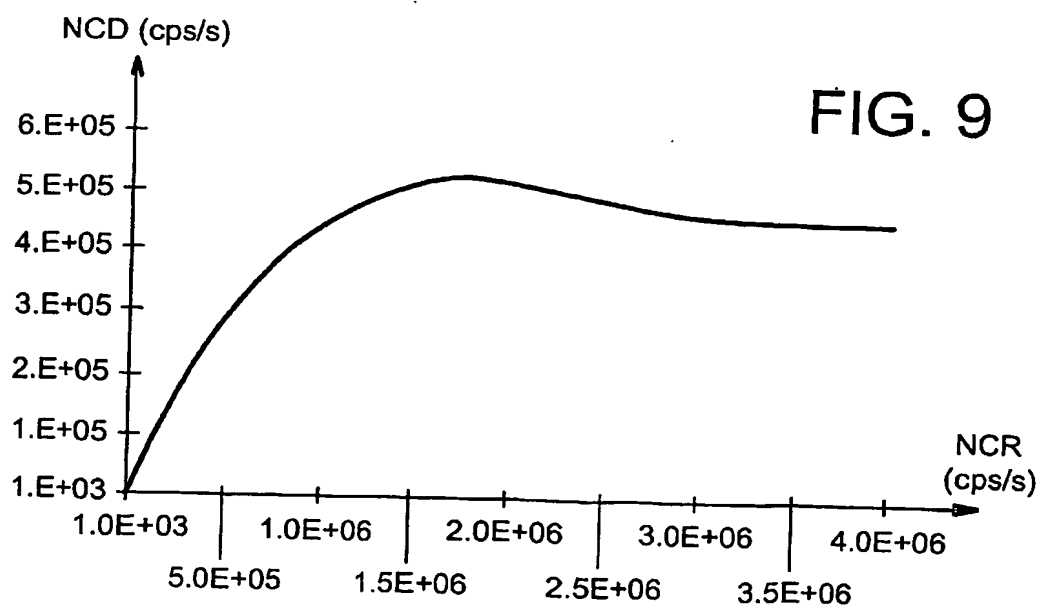


FIG. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/03/50125

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01T1/24 G01T1/17

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01T

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 727 256 A (KUMAZAWA YOSHIHIKO) 23 February 1988 (1988-02-23) the whole document ---	1-11
A	US 5 821 538 A (LEBRUN FRANÇOIS ET AL) 13 October 1998 (1998-10-13) column 1, line 9 -column 2, line 55 column 3, line 40 -column 6, line 42 figures 1,2 ---	1-11
A	US 4 692 626 A (WESTPHAL GEORG P) 8 September 1987 (1987-09-08) column 1, line 5 - line 29 column 3, line 10 -column 4, line 50 column 7, line 50 -column 10, line 13 figures 1,8 --- -/--	1-11

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 March 2004

Date of mailing of the international search report

05/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Coda, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/JP03/50125

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 06, 4 June 2002 (2002-06-04) -& JP 2002 055171 A (SHIMADZU CORP), 20 February 2002 (2002-02-20) abstract</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4727256	A	23-02-1988	JP 1826674 C	28-02-1994
			JP 5033356 B	19-05-1993
			JP 61014590 A	22-01-1986
			JP 1826675 C	28-02-1994
			JP 5033354 B	19-05-1993
			JP 61014591 A	22-01-1986
			DE 3584477 D1	28-11-1991
			EP 0167119 A2	08-01-1986
US 5821538	A	13-10-1998	FR 2738693 A1	14-03-1997
			CA 2185091 A1	13-03-1997
			DE 69620523 D1	16-05-2002
			DE 69620523 T2	14-11-2002
			EP 0762145 A1	12-03-1997
			IL 119158 A	30-11-1999
			JP 9113629 A	02-05-1997
US 4692626	A	08-09-1987	NONE	
JP 2002055171	A	20-02-2002	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/03/50125

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 G01T1/24 G01T1/17

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G01T

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 4 727 256 A (KUMAZAWA YOSHIHIKO) 23 février 1988 (1988-02-23) le document en entier ---	1-11
A	US 5 821 538 A (LEBRUN FRANÇOIS ET AL) 13 octobre 1998 (1998-10-13) colonne 1, ligne 9 -colonne 2, ligne 55 colonne 3, ligne 40 -colonne 6, ligne 42 figures 1,2 ---	1-11
A	US 4 692 626 A (WESTPHAL GEORG P) 8 septembre 1987 (1987-09-08) colonne 1, ligne 5 - ligne 29 colonne 3, ligne 10 -colonne 4, ligne 50 colonne 7, ligne 50 -colonne 10, ligne 13 figures 1,8 --- -/--	1-11

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

& document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

24 mars 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

05/04/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Coda, R

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/JP03/50125

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 06, 4 juin 2002 (2002-06-04) -& JP 2002 055171 A (SHIMADZU CORP), 20 février 2002 (2002-02-20) abrégé</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	1

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux familles de brevets

Demande internationale No

PCT/FR/03/50125

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4727256	A	23-02-1988	JP 1826674 C	28-02-1994
			JP 5033356 B	19-05-1993
			JP 61014590 A	22-01-1986
			JP 1826675 C	28-02-1994
			JP 5033354 B	19-05-1993
			JP 61014591 A	22-01-1986
			DE 3584477 D1	28-11-1991
			EP 0167119 A2	08-01-1986
US 5821538	A	13-10-1998	FR 2738693 A1	14-03-1997
			CA 2185091 A1	13-03-1997
			DE 69620523 D1	16-05-2002
			DE 69620523 T2	14-11-2002
			EP 0762145 A1	12-03-1997
			IL 119158 A	30-11-1999
			JP 9113629 A	02-05-1997
US 4692626	A	08-09-1987	AUCUN	
JP 2002055171	A	20-02-2002	AUCUN	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.